

# 膨張計のいろいろ

東芝 総合研究所 岸井 貴

## 1 膨張測定における問題点

膨張計ないし膨張測定は、普及し、普遍的に行なわれている装置、技術であるが、しかし一方、他の測定に比べて、多くの、または固有の問題をかかえている。これに注意をせずに漫然と、機械を信頼して測った結果は、大変信頼性のないものである。

問題点 1 他種の測定では、有効数字 2 行の測定は容易なことが多い。これに対して熱膨張は、試料の原長に比べて  $10^{-2}$  ~  $10^{-3}$  の量であり、これを有効数字 2 行の精度で測ることは、相当に難しい技術である。

問題点 2 3 軒性率や誘電率のように、温度に敏感でない性質の測定では、温度測定に  $10^{\circ}\text{C}$  や  $20^{\circ}\text{C}$  の誤差があっても、結果に及ぼす効果が小さい。これに対して熱膨張は、温度ないし湯力率に比例する量であるから、温度測定の誤差はそれに比例した誤差を生ずる。

温度、試料へ複数  
を与えずに、

→

弹性応力との関連

→

いしい程度に比例するのであるから、温度測定の誤差はこれに比例した誤差を生ずる。

問題実験3 ここで「温度測定の誤差」と言うものは、分解すれば、温度計の誤差のほかに、温度計と試料との間の温度差、試料全長にわたる温度の不均一、を含んでいて、實際上管理できない量、測定できない量を含んでいる。

問題実験4 以上のような問題実験があるため、膨張計を組んで測定しても、相当の誤差が含まれうる。標準試料による検定は、有効な手段であり、また必要なことであるが、たとえ  $500^{\circ}\text{C}$ までの低温域だけを問題としても、酸化、相変態、流動などの恐れのない、かつ膨張係数の小さくない物質としては、白金しかないと思われる。

問題実験5 標準物質としては、現在米国立標準局(National Bureau of Standard)のものが商業的に入手可能であるが、これには高温域のものは含まれていない。また膨張係数としての殘留誤差としては  $\pm 1 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}$  前後である。

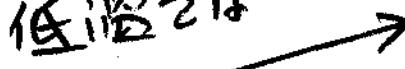
石英ガラス  
恒温膨脹系数  
ガラス。

## 2 膨張測定が行なわれる場合

膨張測定の目的としては、次のような分類ができる。

1. 計量標準 標準試料の検定、保証
2. 材料工業での品質管理、工程管理 特に封着材料、複合材料において重要な。
3. 高温で使用する材料 構造材料、耐熱衝撃材料。
4. 材料の持性値として。
5. 物性研究

低温では  
特に。



上記のうち、5.を除けば、番号が若いほど精度の要求が厳しい。  
5.では精度が高いものがある。2.では、膨張係数として  
 $\pm 2 \times 10^{-7}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 、温度差  $300^{\circ}\text{C}$ 、試料長  $5\text{cm}$  に換算した膨張として  $\pm 3\mu\text{m}$  を要求される。

## 3. 膨張計の分類

現存の膨張計の大分類として、筆者は次のように分けてみたい。

者はこれで精巧的に測定をした。  
今でも引用  
高温では  
これがやっと  
問題が少ない。

1. 獨立測長式
2. 半獨立測長式
3. 示差式
  - 3.-1 炉外測長式 試料の伸びを、標準材料の助けなしに測定する。干渉膨張計
  - 3.-2 炉内測長式 炉外で定温保持された材料を基準として伸びを測る。双望遠鏡方式。
4. 体積膨張計 基準材料との伸びの差を測る。

3.-1 に属するものは、非常に多い。取扱いも簡便である。3.-2 は低温用のものだけで、高温用の例はない。

3.-2 を除けば、いずれの方式の原型も 1900 年までに出揃っている。原理的な面においての精度（感度ではない。）の向上は遅々としたものであった。誇張した言い方をすれば、発展がなかったとも言える。

「発展がなかった」理由の一つは、当時の測長は原器から導かれていたのに對し、その後測長方式が光干涉に移って来ており、光干涉はすでに膨張計に取り入れられていたからである。

$10^{\circ}\text{C} \rightarrow 10^{-4}$

## 4 精度向上のためのチェックポイント

膨張計では普通、長さ測定の精度が 温度(分布、試料/温度計間の温度差)の面での精度を上回っていることが多い。温度の面での問題を少なくすれば、再現性はかなり向上する。

測定圧の影響は、彈性の面だけから見れば小さい。しかし、軟化、クリープをする材料、温度域では影響が大きい。また、示差式においては、測定圧は伸び伝達系の撓みを起して、誤差を極端に大きくすることがある。

上記の理由によって、伸び伝達系は、撓まないように、彈性論的に考慮が拂わっていなければならぬ。

また、示差式で伸び伝達部に高膨張材料を使っている時には、並行する材料間の温度差をなくすることが大切である。

以上の注意を拂った上で、標準物質による検定をする。上記の問題点を放置したままでは、検定の意味は薄い。

## 5 光干渉による伸び測定

最近における電子工学、機械工学の発展によって、膨張計に各種の技術が適用され、膨張計の種類が多くなり、感度(精度では

ない)も極端に大きいものが出てきた。しかし、筆者は精度の点では、光干涉を利用するものが最良だと信じている。

この理由を挙げると

1. 粗い測定で伸びの  $0.03\mu m$ , 精密には  $0.01\mu m$  の精度がある。
2. 調整の必要がない。
3. 長期にわたって精度を保持する, という努力が要らない。
4. 試料や操作誤まりに責任のある誤差はあり得ても, 測長系による誤差は皆無か, または非常に稀と思われる。
5. 将来, 絶対測定を試みる人があったとすれば, 干渉膨張計によらざるを得ない。
6. 高温部と測長系との距離が長くとも, 精度に影響がない。

従って, レーザーの出現が膨張測定に与えた影響は大きい。干渉性の良さ, 平行性, 單色性, 光強度のすべてが, 干渉膨張計に都合が良い。

レーザーにより, 自記化が非常に簡単になり実用性が増した。  
将来の発達の方向としては

1. レーザーの波長安定化, 單一モード化 (コーニング社の実施例あり。)

2. 热差膨張計の測長部を干渉計化する(東芝に実施例あり)。
  3. 干渉部をファブリ・ペロー型とする(現在はフィゾー型)。
- これ以上の高感度化は、測温系の誤差を  $0.1^{\circ}\sim 0.3^{\circ}\text{C}$  以下にしない限り、意味がない。  
干渉膨張計には、急激な転移のある試料、不均質な試料に適しないという欠点がある。この改善に努力することは意味がある。

ついでに述べると、光干渉方式は、伸び拡大のためには、光干渉について望ましいやり方だと考えている。

## 6 自記化の問題

VTR

熱膨張の自記化は、見掛け上容易である。しかし、精度を考慮せずに、形式的に自記化するのは意味がないと思う。自記化のために機械 → 電気変換センサーを使っている時には、その感度、感度の恒常性に注意するとともに、定期的な検定が必要である。

既存の膨張計を自記化する場合、試料、測長系に変化をえないような工夫をしないと、データの連続性は失なわれる。

自記 = デタ処理  
でないところ

熱膨脹の自己化については筆者もかっては興味を持ち、室協誌に2度にわたり執筆したことがある。しかし現在では、自己化は容易なことであり、調べる意味も小さい。精度の向上と結びついた自己でないと、興味が持てない。

## 7 麦近の膨張計の発達

測定目的の多様化と、利用できる技術の多様化により、  
膨張計の種類が非常に多くなった。これは特に、低温、極  
低温での測定が求められ、この場合に使用構成材料と構造  
に自由度がふえたからであると言える。

逆の見方をすれば、膨張計は目的に応じ工夫して、構成するものであるとも言える。

その他、X線回折のほかに、中性子回折を用いたもの、薄膜の膨張を測ろうとしたもの、などは新しい方式だと言える。

低温での物質の膨張係数は零に近づくことが多いし、またその近づき方に物性論的意味があるので、その測定のために、精度は別としても、極めて高感度の方式が工夫されることがある。

これらのうち、次の諸項目に絞って説明をする。

### 7.1 干渉膨張計の改良

干渉膨張計は、発明以来現在まで、原理はほとんど“かわらない”が、次のように多数回の改良が加えられてきた。

a. 目視による測定

b. 流し撮り写真フィルムによる自動記録 NBS

c. 光電子増倍管による自動記録 NBS

d. ガスレーザーの導入

d-1 波長安定化レーザーによる長尺試料の測定 コニング社

d-2 流し撮り写真フィルムによる自動記録 IBM

d-3 ビームの平行性の活用 清原光学

d-4 集束ビームの活用

d-5 VTR の利用

東芝 1970年  
東芝

## 7.2 筆者による示差膨張計の改良

- a. 光てこ式拡大の自記化
- b. 固体電子素子の導入

計量計

オーストラリア

絶対膨張計

## 7.3 炉内測長式膨張計の二,三の実例